



Omni-FD系列 平场光栅极紫外光谱仪

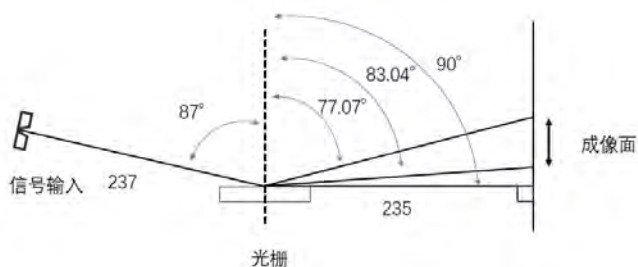
北京卓立汉光仪器有限公司推出基于平场光栅的像差校正光栅光谱仪，可以为客户提供1-80nm信号测量方案，解决从软x射线-极紫外-真空紫外信号分析。该谱仪同时提供相应相机接口，可以配合真空相机（国产或进口）或是MCP板进行不同能量信号的测试。可应用于极紫外信号标定，高次谐波等高能实验。

本谱仪提供三种光栅，可以分别测试1-5nm，5-20nm以及20-80nm的信号测量，设备占空间小，并且接受个性化定制，可以完美配合您的实验。

谱仪基本参数：

- 入射角度 87度
- 适用设备 MCP（微通道板）或直接真空相机
- 真空度 低于10E-5Pa
- 光栅尺寸 50X30mm
- 独特的进光口设计，可解决入口杂散光干扰问题
- 独特的谱线校准方案
- 根据测试不同波长能量提供多种光栅
- 探测面可连续可调，方便不同探测器焦深
- 独特的零级干扰去除方案

1200g/mm光栅衍射示意图：



光栅信息：

光栅刻画线 (g/mm)	300	1200	2400
分辨率 (nm)	0.15	0.03	0.02
光谱范围 (nm)	20-80	5-20	1-5
光谱范围 (eV)	65-15	248-62	1240-248

北京卓立汉光仪器有限公司

服务网络: 北京 | 上海 | 深圳 | 成都 | 西安 | 长春 | 郑州 | 无锡
电话: 010 56370168 邮箱: info@zolix.com.cn www.zolix.com.cn



关注了解更多



一键触达光电臻品